

検査日	2025年2月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	表面形状測定機	電源	1φ 100V	測定長さ	5μm～50mm
型式	DEKTAK 8	電力量	Max /720VA	最大サンプリング数	30,000ポイント
メーカー名	(株)アルバック (Veeco)	周波数	50/60Hz	自動多点測定数	最高200点
機械Ser,No	2316	測定分機能	min/0.1nm	Foot Print	W1210xD950 ^{mm}
製造年月	—	ワークサイズ	φ210mm	OS:Windows XP	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・ 未対象 ・NG) TP (済・ 未対象 ・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.電源投入⇒問題なし。
- 2.測定ソフト起動⇒initialize完了問題なし。
- 3.Stage動作⇒問題なし。
- 4.除振台エア供給⇒問題なし。/StageVacuum切り替え⇒問題なし。
- 5.Stage動作⇒問題なし。
- 6.Sample測定⇒問題なし。(段差:9543 Å & 10K Å)



除振台エア供給前



除振台エア供給



除振台フロート確認



本体カバー修繕前 (右側)



本体カバー修繕前 (左側)



本体カバー修繕後 (右側)



本体カバー修繕後 (左側)

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作:OK

作業工数 [4.5 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

(備考欄コメント)

修理・改造履歴

※2024年2月14日 動作確認/徳永

2024年10月18日 動作確認/徳永

出荷日 年 月 日

[責任者]



【Sample測定】



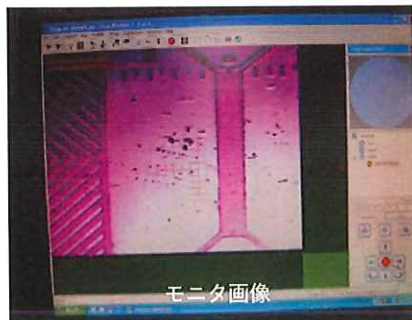
弊社所有標準サンプル 9543Å



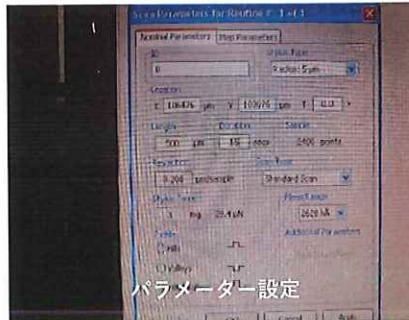
サンプルセット方向

Sample許容範囲(弊社基準5%以内)

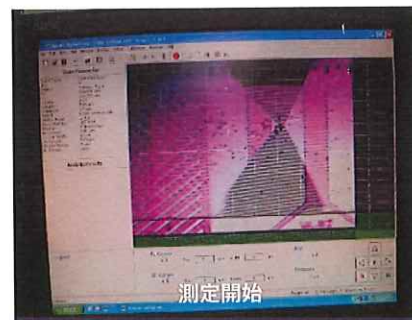
9066Å~10020Å



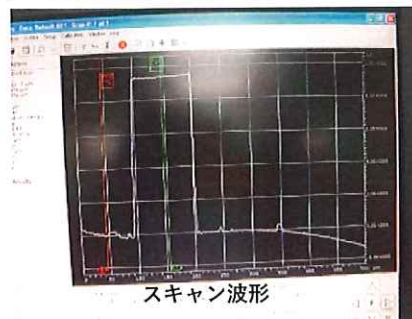
モニタ画像



パラメーター設定



測定開始

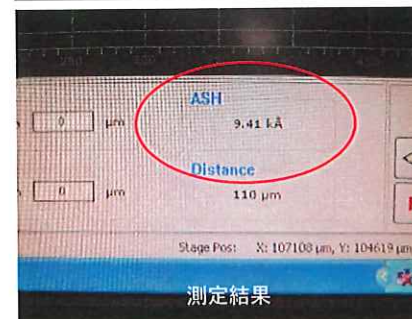


スキャン波形

Scan Parameters	
Scan Type:	Standard Scan
ID:	0
Stylus:	Radius: 5 µm
Xi:	106476 µm
Yi:	103076 µm
Theta:	0.0°
Length:	500 µm
Duration:	15 sec
Resolt:	0.111 µm/sample
Stylus Force:	3 mg
Meas Range:	2620 kA
Profile:	Hills&Valleys
R. Cursor:	100 µm
R. Cur Width:	0 µm
M. Cursor:	500 µm
M. Cur Width:	0 µm
D. Range:	Auto
Plot:	Raw

スキャンパラメーター

Analytic Results



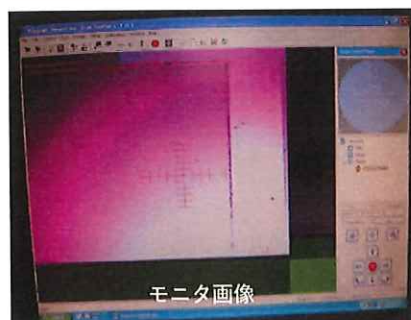
測定結果



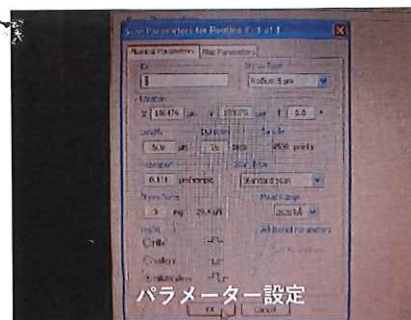
本機付属標準サンプル 10kÅ

Sample許容範囲(弊社基準5%以内)

9500Å~10500Å



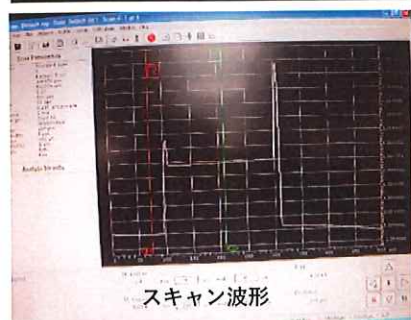
モニタ画像



パラメーター設定



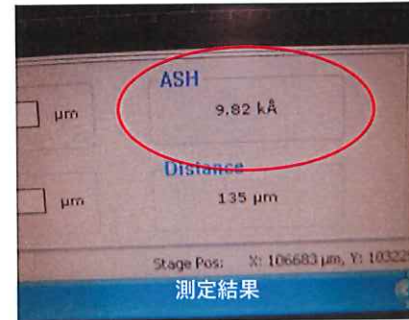
測定開始



スキャン波形

Scan Parameters	
Scan Type:	Standard Scan
ID:	0
Stylus:	Radius: 5 µm
Xi:	106476 µm
Yi:	103076 µm
Theta:	0.0°
Length:	500 µm
Duration:	15 sec
Resolt:	0.111 µm/sample
Stylus Force:	3 mg
Meas Range:	2620 kA
Profile:	Hills&Valleys
R. Cursor:	100 µm
R. Cur Width:	0 µm
M. Cursor:	500 µm
M. Cur Width:	0 µm
D. Range:	Auto
Plot:	Raw

スキャンパラメーター



測定結果